

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)



21 10 2004

(44)

PCT/EP200 4 / 0 5 2 4 4 7

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

REC'D	02 NOV 2004
WIPO	PCT

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 12 OCT. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

► N° Indigo 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/mn

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

Réservé à l'INPI

BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

cerfa
N° 11354*03

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 540 @ W / 030103

REMISE DES PIÈCES
DATE 21 OCT 2003
LIEU 75 INPI PARIS
N° D'ENREGISTREMENT
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE
PAR L'INPI 0312294
21 OCT. 2003

1 NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

Mariano DOMINGUEZ
THALES INTELLECTUAL PROPERTY
31-33, Avenue Aristide Briand
94117 ARCUEIL CEDEX

Vos références pour ce dossier
(facultatif) 63207

Confirmation d'un dépôt par télécopie

☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

2 NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

*Demande de brevet initiale
ou demande de certificat d'utilité initiale*

N°

Date

N°

Date

Transformation d'une demande de
brevet européen *Demande de brevet initiale*

☐

N°

Date

3 TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

DISPOSITIF DE MESURE NON DISSIPATIF DU COURANT DANS UNE INDUCTANCE

4 DÉCLARATION DE PRIORITÉ OU REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

5 DEMANDEUR (Cochez l'une des 2 cases)

☐ Personne morale

☐ Personne physique

Nom
ou dénomination sociale

THALES

Prénoms

Forme juridique

S.A.

N° SIREN

341470656

Code APE-NAF

Domicile
ou
siège

Rue

45, Rue de Villiers

Code postal et ville

92526 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

Pays

FRANCE

Nationalité

Française

N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

☐ S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Remplir impérativement la 2^{ème} page



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE
page 2/2

BR2

REMISE DES REÇUS DATE 12 OCT 2003 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0312294 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI
6 MANDATAIRE (s'il y a lieu)		
Nom	DOMINGUEZ	
Prénom	Mariano	
Cabinet ou Société	THALES INTELLECTUAL PROPERTY	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel	8325	
Adresse	Rue	31-33, Avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	9341117 ARCEUIL CEDEX
	Pays	FRANCE
N° de téléphone (facultatif)	01 41 48 45 20	
N° de télécopie (facultatif)	01 41 48 45 01	
Adresse électronique (facultatif)		
7 INVENTEUR (S)		
Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques		
Les demandeurs et les inventeurs sont les mêmes personnes	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non : Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		
Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)		
Établissement Immédiat ou établissement différé	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		
Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) <input type="checkbox"/> Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence) : AG		
10 SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		
<input type="checkbox"/> Cochez la case si la description contient une liste de séquences		
Le support électronique de données est joint	<input type="checkbox"/>	
La déclaration de conformité de la liste de séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe	<input type="checkbox"/>	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes		
11 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) Mariano DOMINGUEZ		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI M. ROCHET

DISPOSITIF DE MESURE NON DISSIPATIF DU COURANT DANS UNE INDUCTANCE

L'invention concerne un dispositif de mesure non dissipatif, de faible coût et encombrement réduit, du courant traversant une inductance insérée dans un dispositif électrique ou électronique.

5 Dans certaines applications électroniques il est nécessaire de mesurer la valeur du courant dans les inductances avec une bonne précision et en perturbant le moins possible le dispositif dans lequel se trouve insérée l'inductance. Nous pouvons citer par exemple la mesure du courant dans les inductances des alimentations à découpage, entre autres, les hacheurs série
10 à découpage abaisseurs ou élévateurs de tension (respectivement « buck converter » et « boost converter » en langue anglaise).

La méthode classique qui est la plus utilisée consiste à placer un shunt de mesure en série avec l'inductance ce qui permet d'obtenir l'image du courant dans l'inductance en mesurant la tension aux bornes du shunt.
15 Cette solution présente l'avantage d'être simple à mettre en œuvre, en revanche elle comporte un inconvénient majeur. En effet la puissance dissipée dans le shunt contribue à dégrader le rendement global du convertisseur ce qui n'est pas toujours acceptable, ceci est d'autant plus vrai que la tension de sortie du dispositif de conversion d'énergie est faible. Pour
20 éviter cette contrainte, une solution de mesure de courant non dissipative présentée dans la figure 1 est utilisée.

La figure 1 montre un schéma d'un dispositif de mesure 10 du courant I traversant une inductance 12. L'inductance 12 est représentée par son schéma équivalent comportant une partie réactive pure, soit la partie
25 inductive L en série avec une résistance R_L . L'inductance comporte une borne A et une borne B.

Le dispositif de mesure 10, à faible coût et très peu dissipatif, est mis en parallèle sur des bornes A et B de l'inductance 12. Le dispositif de mesure 10 comporte une résistance R_2 en série avec une résistance R_1 en
30 parallèle avec une capacité C_1 , la résistance R_2 étant connectée à la borne A, la résistance R_1 à la borne B.

Le but de ce montage de l'état de l'art est d'obtenir une tension aux bornes de la capacité C1 proportionnelle à la tension aux bornes de la résistance RL de l'inductance 12 donc proportionnelle au courant I dans l'inductance 12 (ou dans l'inductance L). Les courants dans les résistances R2 et R1 sont négligeables devant le courant I dans l'inductance 12.

Pour dimensionner les éléments du dispositif, il est important de respecter la contrainte suivante : $\frac{L}{RL} = \frac{R1 \cdot R2}{R1 + R2} \times C1$ équation (1)

Si la condition exprimée par l'équation (1) est vérifiée, V_{C1} est l'image du courant dans l'inductance. La tension V_{C1} aux bornes de C1 est donnée par la relation suivante :

$$V_{C1} = \left(\frac{R1 \cdot RL}{R1 + R2} \right) \cdot I \quad \text{équation (2)}$$

Le dispositif de la figure 1 permet donc d'obtenir l'image d'un courant traversant une inductance à condition de connaître la valeur de la résistance intrinsèque RL de l'inductance.

On peut remarquer que l'image du courant est donnée par une équation du type : $V_{C1}(I) = a \cdot I$ avec « a » le coefficient de proportionnalité.

Pour certaines applications, il est nécessaire que la mesure présente une tension de décalage (ou tension d'offset), c'est à dire que contrairement à l'équation précédente (2), lorsque le courant I est nul la tension V_{C1} n'est pas nulle. L'équation qui traduit ce comportement est de la forme : $V_{C1}(I) = a \cdot I + b$ avec :

« a » le coefficient de proportionnalité et « b » l'ordonnée à l'origine (tension d'offset dans notre cas).

Pour réaliser ce décalage sur la mesure, il suffit de joindre un montage supplémentaire au dispositif de la figure 1.

La figure 2 montre un dispositif de mesure du courant I dans l'inductance 12 avec un décalage de tension V_{offset} .

Dans le dispositif de mesure du courant de la figure 2, la tension image du courant dans l'inductance n'est plus V_{C1} , comme dans le dispositif de la figure 1, mais devient la tension V_{mes} .

Le circuit de mesure de la figure 2 comporte en plus des éléments de la figure 1, un circuit de décalage 14 ayant un générateur E de tension

continue V_{out} connecté en parallèle, avec une résistance de décalage R_{offset} en série avec deux résistances en parallèle $R3$ et $R4$. Le pôle positif du générateur étant connecté au point commun des deux résistances $R3$ et $R4$ et à la borne B de l'inductance 12, le pôle négatif du générateur étant
 5 connecté à la résistance R_{offset} . Le générateur de tension E peut être la capacité de sortie d'un convertisseur, ce qui est le cas pour un hacheur de type Buck par exemple.

Il est également possible de placer une capacité $C1'$ en parallèle sur $R3$ et $R4$ afin d'équilibrer les impédances sur les deux branches du dispositif
 10 de mesure.

La tension V_{mes} est mesurée entre le point commun ca entre les deux résistances $R2$ et $R1$ et le point commun cb entre la résistance R_{offset} et les deux résistances $R3$ et $R4$ en parallèle.

On peut écrire l'expression de V_{mes} relative au dispositif de la
 15 figure 2 :

$$V_{mes} = \left(\frac{R1 \cdot RL}{R1 + R2} \right) \cdot I + V_{out} \cdot \left(1 - \frac{R_{offset}}{\frac{R3 \cdot R4}{R3 + R4} + R_{offset}} \right) \quad \text{équation (3)}$$

20 La tension V_{out} étant constante, la tension V_{offset} est donc également constante, l'équation obtenue est donc de la forme : $V_{mes}(I) = a \cdot I + b$, avec :

$$a = \left(\frac{R1 \cdot RL}{R1 + R2} \right) \quad \text{et} \quad b = V_{out} \cdot \left(1 - \frac{R_{offset}}{\frac{R3 \cdot R4}{R3 + R4} + R_{offset}} \right)$$

25 Ce type de mesure est utilisé dans les dispositifs comme les convertisseurs à découpage de l'électronique de puissance pour lesquels il est nécessaire de limiter le courant traversant les inductances. Pour cela, la tension de mesure V_{mes} est comparée, à l'aide d'un comparateur à seuil, à une tension de seuil V_{seuil} correspondant à un courant maximal I_{max} .

30 Cependant le dispositif de l'état de l'art représenté à la figure 2, présente un inconvénient majeur car la valeur de la résistance RL de l'inductance dépend de la température à laquelle elle est soumise, la mesure

de courant qui est obtenue présente donc une erreur liée à la température. La conséquence est que la mesure du courant dans l'inductance et donc la limitation de courant I_{lim} dépend de la température.

La figure 3 montre une courbe de variation du courant de limitation I_{lim} en fonction de la température T d'un circuit de limitation de courant comportant un comparateur à seuil et le dispositif de mesure de la figure 2. La variation du courant de limitation en fonction de la température est de 60% entre -40°C et 100°C . Une telle dispersion sur la valeur du courant de limitation entraîne un surdimensionnement du circuit de puissance pour qu'il puisse supporter la courant de limitation à température basse ce qui représente un inconvénient majeur.

Afin de pallier les inconvénients des dispositifs de la mesure du courant de l'état de l'art, l'invention propose un dispositif de mesure de courant dans une inductance destiné à être connecté en parallèle sur ladite inductance comportant deux bornes A et B, caractérisé en ce qu'il comporte :

- un réseau en parallèle avec l'inductance connecté aux bornes A et B ayant une résistance $R2$ en série avec une résistance $R1$ en parallèle avec une capacité $C1$,
- un circuit de décalage de tension ayant un générateur E de tension continue connecté en parallèle avec une résistance de décalage (R_{offset}) en série avec deux résistances en parallèle $R3$ et $R4$, le pôle positif du générateur étant connecté au point commun des deux résistances $R3$ et $R4$ et au point commun de la résistance $R1$ et la capacité $C1$ du réseau destiné à être connecté à une des deux bornes de l'inductance, le pôle négatif du générateur E étant connecté à la résistance de décalage ;
- un circuit de compensation en température comportant une source de courant contrôlée en fonction de la température, une des deux bornes de la source de courant étant connectée au pôle négatif du générateur E , l'autre borne de la source de courant étant connectée à des points différents du dispositif de mesure selon le sens de la variation du courant de la source en fonction de la température ;

et en ce que la mesure de tension V_{mes} , image du courant dans l'inductance, est effectuée entre le point commun des résistances $R1$, $R2$ du réseau et le point commun de la résistance de décalage et des deux résistances $R3$ et $R4$.

Il faut vérifier en outre la condition exprimée par l'équation suivante :

$$\frac{L}{RL} = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2} \cdot C1 ,$$

en considérant l'inductance comme représentée par un schéma équivalent comportant une partie inductive L et une partie résistive RL en série, pour que la tension V_{C1} aux bornes de la capacité C1 soit indépendante de la tension V_L aux bornes de l'inductance.

Dans une réalisation du dispositif de mesure de courant selon l'invention, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un premier sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R1 et R2 du réseau.

Dans une autre réalisation du dit dispositif, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un second sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R3, R4 et la résistance de décalage (Roffset) du circuit de compensation.

Les figures 4b, 4c et 4d montrent différentes représentations de la source de courant du circuit de compensation en température.

La source de courant contrôlée en fonction de la température θ peut être représentée par :

- un modèle idéal de source de courant $I_{parf}(\theta)$, représenté à la figure 4b ;
- un modèle équivalent de Norton $I_{nor}(\theta)$, représenté à la figure 4c, comprenant une source de courant parfaite variant en fonction de la température en parallèle avec une résistance R_{nor} ;
- un modèle équivalent de Thévenin, représenté à la figure 4d, comprenant une source de tension $E_{th}(\theta)$ variant en fonction de la température en série avec une résistance R_{th} .

Selon le sens de variation du courant de la source de courant pour la compensation en température, le circuit de compensation en température sera relié par une de ces deux bornes, soit au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau, soit au point de connexion entre les résistances R3, R4 et la résistance de décalage (Roffset) du circuit de compensation et par l'autre borne au pôle négatif du générateur E. Dans ce

dernier cas le circuit de compensation en température est en parallèle avec la résistance de décalage (Roffset)

Ce dispositif permet, par injection de courant contrôlé en fonction de la température, d'obtenir une tension (V_{mes}) image du courant dans l'inductance quelle que soit la température de celle-ci.

La source de courant du circuit de compensation en température peut être réalisée de différentes façons, par exemple à partir des tensions aux bornes de réseaux de composants électriques ou électroniques parmi lesquels nous pouvons citer :

- 10 - les résistances variables en fonction de la température (résistances platines, résistance silicium par exemple résistance de dénomination commerciale KTY du fabricant « INFINEON » ...);
- les diodes dont la tension de seuil varie avec la température ($-2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$);
- 15 - ou tout autre circuit électronique fournissant une tension ou un courant dépendant de la température (capteur de température intégré comme le AD590 du fabricant « Analog Device »...).

Une capacité C1' peut être ajoutée en parallèle sur R3 et R4 afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa précision.

20 L'invention sera mieux comprise à l'aide d'un exemple de réalisation non limitatif d'un dispositif de mesure selon l'invention en référence aux figures dans lesquelles :

- la figure 1, déjà décrite, représente d'un dispositif de mesure de l'état de l'art du courant traversant une inductance ;
- 25 - la figure 2, déjà décrite, représente un dispositif de mesure du courant dans l'inductance de la figure 1, avec un décalage de tension ;
- la figure 3, déjà décrite, représente une courbe de variation du courant de limitation en fonction de la température d'un circuit de limitation de courant utilisant le dispositif de mesure de la figure 2 ;
- 30 - la figure 4a, représente un dispositif de mesure de courant dans une inductance dans un cas général de l'invention avec un décalage de tension ;
- les figures 4b, 4c et 4d déjà décrites montrent différentes représentations de la source de courant du circuit de compensation en température ;

- la figure 5 montre une réalisation à titre d'exemple du dispositif de mesure de courant dans une inductance, selon l'invention ;
- la figure 6 montre à titre de comparaison les variations du courant de limitation en fonction de la température avec le dispositif selon l'invention (tracé continu) et sans le dispositif (tracé discontinu).

Le schéma de la figure 4a montre un dispositif de mesure de courant dans une inductance dans un cas général de l'invention avec un décalage de tension.

La figure 4a montre :

- l'inductance 12 représentée par son schéma équivalent comportant une partie réactive pure L , en série avec une résistance R_L .
- un dispositif de mesure de courant dans l'inductance 12, selon l'invention connecté en parallèle sur l'inductance comportant les deux bornes A et B,

Le dispositif de la figure 4a comporte :

- le réseau 10 tel que représenté à la figure 2 (ou le dispositif de mesure de l'état de l'art de la figure 1) en parallèle avec l'inductance 12 connecté aux bornes A et B ayant la résistance R_2 en série avec la résistance R_1 en parallèle avec la capacité C_1 ,
- un circuit de décalage de tension 16 ayant le générateur E de tension continue V_{out} connecté en parallèle avec la résistance de décalage R_{offset} en série avec les deux résistances en parallèle R_3 et R_4 et au point commun de la résistance R_1 et la capacité C_1 reliés à la borne B de l'inductance 12. Le pôle négatif du générateur est connecté à la résistance de décalage R_{offset} ;
- un circuit de compensation en température 20 comportant une source de courant variant en fonction de la température pouvant être représentée par une source de courant parfaite variant en fonction de la température $I_{parf}(\theta)$ (figure 4b), ou par un modèle équivalent de Norton $I_{nor}(\theta)$ en parallèle avec une résistance R_{nor} (figure 4c), ou un modèle équivalent de Thévenin (figure 4d) comprenant une source de tension variant en fonction de la température $E_{th}(\theta)$ en série avec une résistance R_{th} .

Selon le sens de la variation du courant de la source de compensation en température (générateur de courant), le circuit de compensation en température sera connecté, soit, pour un premier sens de variation du

courant, par une de ces deux bornes, au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau10 par la connexion S1 représentée en trait discontinu sur la figure 4a, soit, pour le second sens de variation de courant, connectée au point commun de la résistance de décalage et des deux
5 résistances R3 et R4 par la connexion S2 représentée en trait discontinu (soit dans ce second cas en parallèle avec la résistance d'offset Roffset).

La capacité C1' peut être ajoutée en parallèle sur les résistances R3 et R4 afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa précision.

10 La mesure de tension Vmes image du courant I dans l'inductance 12 est effectué entre le point commun entre les résistances R1, R2 du réseau et le point commun entre la résistance de décalage Roffset et les deux résistances R3 et R4.

La figure 5 montre une première réalisation du dispositif de mesure de
15 courant dans une inductance, selon l'invention.

Le dispositif comporte :

- le réseau 10 tel que représenté à la figure 2 en parallèle avec l'inductance 12 connecté aux bornes A et B ayant la résistance R2 en série avec la résistance R1 en parallèle avec la capacité C1,
- 20 - une circuit de décalage de tension 22 comportant le générateur E connecté en parallèle avec une résistance de décalage R15 (ou résistance d'offset) en série avec deux résistances R3 et R4 en parallèle. Le pôle positif du générateur E est connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 du côté de ces résistances et au point commun de la résistance R1 et la
25 capacité C1 reliés à la borne B de l'inductance 12, le pôle négatif du générateur E étant relié à la résistance de décalage R15.

-
- un circuit de compensation en température 24 comportant une résistance R14 reliée par une de ces deux bornes au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau et par l'autre borne à une sortie ps
30 d'un pont diviseur comportant une résistance R13 en série avec une thermistance RKTY (ref : KTY 13-6 de INFINEON), le pont diviseur étant connecté, du côté de la thermistance RKTY au pôle positif du générateur E et du côté de la résistance R13 au pôle négatif du générateur E.

La source de tension E_{th} de compensation en température (figure 4d) est obtenue dans le cas de la réalisation de la figure 5, par la tension du point commun entre les résistances R_{KTY} et R_{13} .

Une capacité $C1'$ est connectée en parallèle sur R_3 et R_4 afin d'améliorer le fonctionnement du dispositif et augmenter sa précision.

La mesure de tension V_{mes} image du courant I dans l'inductance 12 est effectuée entre le point commun des résistances R_{15} , R_3 , R_4 et le point commun des résistances R_{14} , R_1 , R_2 .

Nous allons par la suite exprimer les relations existant entre les différents éléments du dispositif selon l'invention représentée à la figure 5.

La résistance R_L représente la résistance intrinsèque de l'inductance 12. La résistance R_L varie en température et sans circuit de compensation il se produit une erreur de mesure du courant dans l'inductance.

Nous allons considérer, à titre d'exemple, le cas d'utilisation du dispositif de mesure selon l'invention de la figure 5 dans un convertisseur de tension à découpage fonctionnant avec une fréquence de découpage F , ayant un circuit de limitation de courant (non représenté sur les figures). Le circuit de limitation comporte essentiellement un comparateur à seuil recevant d'une part la tension V_{mes} image du courant dans l'inductance 12 et d'autre part une tension de seuil V_{comp} représentant un courant maximum à ne pas dépasser. Dans l'exemple de réalisation de la figure 5, les valeurs des composants sont :

$$R_{L0} = 8m\Omega \text{ pour une température ambiante } T_0 = 25^\circ C$$

La résistance de l'inductance $R_L(T)$ en fonction de la température est donnée par

$$R_L(T) = R_{L0} \cdot [1 + 0,0038(T - T_0)]$$

Le schéma de la figure 5 permet une compensation thermique de la mesure du courant pour obtenir une limitation de courant maximum indépendante de la température. A cet effet on utilise une thermistance R_{KTY} à base de silicium dont la résistance varie de façon sensiblement linéaire en fonction de la température.

$$R_{KTY0} = 2000\Omega ,$$

$$R_{KTY0} \text{ pour une température ambiante de } T_0 = 25^\circ C$$

$$R_{KTY}(T) = R_{KTY0} \cdot [1 + 7,88 \cdot 10^{-3} \cdot (T - T_0) + 19,37 \cdot 10^{-6} \cdot (T - T_0)^2]$$

Le système sera dimensionné entre les deux températures extrêmes T_h et T_b . Il s'agit de la température de l'inductance à pleine puissance, comprenant donc la température ambiante externe ajoutée à l'élévation de température interne du boîtier dans lequel peut se trouver l'inductance ainsi
 5 que celle de l'inductance.

La mesure de courant V_{mes} est appliquée à une entrée du circuit comparateur de courant (non représenté sur les figures). Le seuil maximum V_{comp} du courant V_{mes} correspondant à un courant I_{max} de limitation est appliquée à l'autre entrée du comparateur. Par exemple dans cette
 10 réalisation :

$$V_{comp} = 75\text{mV}$$

La tension V_{offset} à appliquer en entrée du comparateur, lorsque le courant est nul, est :

$$V_{offset} = 3\text{mV}$$

15 Le courant maximum I_{max} de sortie du convertisseur (courant moyen dans l'inductance) est :

$$I_{max} = 8\text{A}, \text{ pour un courant nominal}$$

Comme cela a été dit précédemment, pour obtenir une mesure correcte de courant dans l'inductance, la relation suivante doit être
 20 respectée :

$$R_{1P2} \cdot C1 = \frac{L}{RL}$$

R_{1P2} étant la résistance équivalente à $R1$ et $R2$ en parallèles.

Comme RL varie en température, en pratique, on peut choisir la valeur médiane RL_{med} .

25 $R13$ sera choisie à priori pour obtenir une tension de pont ($RKTY$, $R13$) qui évolue significativement en température tout en limitant le courant dans $RKTY$ pour éviter les auto échauffements.

Il est donc possible d'exprimer la relation reliant V_{mes} et le courant I dans l'inductance de la façon suivante :

30

$$V_{mes} = \frac{R2 \cdot R14}{(R1 + R2) \cdot (R_{1P2} + R14)} \cdot RL \cdot I + V_{out} \cdot \left(\frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R15} - \frac{RKTY}{RKTY + R13} \cdot \frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R14} \right)$$

avec $RL(T)$ résistance de l'inductance en fonction de la température

avec $RKTY(T)$ résistance variable en fonction de la température

Le calcul du courant de limitation I_{lim} réglé par la tension de seuil
 5 sur le comparateur est donné par l'expression :

$$I_{lim\ Comp}(T) = \frac{V_{comp} + V_{out} \cdot \left(\frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R_{14}} \cdot \frac{RKTY(T)}{RKTY(T) + R_{13}} - \frac{R_{1P2}}{R_{1P2} + R_{15}} \right)}{\frac{R_2}{R_2 + R_1} \cdot \frac{R_{14}}{R_{14} + R_{1P2}} \cdot RL(T)}$$

Les courbes de la figure 6 montrent les variations du courant de
 10 limitation I_{lim} en fonction de la température T en degrés, la courbe L1
 montrant cette variation dans le cas d'un système non équipé du dispositif de
 l'invention, la courbe L2 dans le cas d'un système équipé du dispositif de
 mesure selon l'invention. Ces courbes permettent de constater l'efficacité du
 dispositif de mesure selon l'invention, la variation de courant de limitation
 15 avec le dispositif compensé en température selon l'invention étant quasiment
 nulle.

REVENDECATIONS

1. Dispositif de mesure de courant dans une inductance (12) destiné à être connecté en parallèle sur ladite inductance comportant deux bornes A et B, caractérisé en ce qu'il comporte :

- un réseau en parallèle (10) avec l'inductance connecté aux bornes A et B ayant une résistance R2 en série avec une résistance R1 en parallèle avec une capacité C1,

- un circuit de décalage de tension (14, 16, 22) ayant un générateur E de tension continue connecté en parallèle avec une résistance de décalage (Roffset, R15) en série avec deux résistances en parallèle R3 et R4, le pôle positif du générateur étant connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 et au point commun de la résistance R1 et la capacité C1 du réseau destiné à être connecté à une des deux bornes de l'inductance, le pôle négatif du générateur E étant connecté à la résistance de décalage ;

- un circuit de compensation en température (20, 24) comportant une source de courant contrôlée en fonction de la température, une des deux bornes de la source de courant étant connectée au pôle négatif du générateur E, l'autre borne de la source de courant étant connectée à des points différents du dispositif de mesure selon le sens de la variation du courant de la source en fonction de la température ;

et en ce que la mesure de tension Vmes, image du courant dans l'inductance, est effectuée entre le point commun des résistances R1, R2 du réseau et le point commun de la résistance de décalage et des deux résistances R3 et R4.

2. Dispositif de mesure de courant selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'inductance étant équivalente à une partie inductive pure L en série avec une partie résistive RL le réseau en parallèle avec l'inductance vérifiant la condition exprimée par la relation :

$$\frac{L}{RL} = \frac{R1 \times R2}{R1 + R2} \times C1 \quad \text{pour que la tension } V_{C1} \text{ aux bornes de la}$$

capacité C1 soit indépendante de la tension VL aux bornes de l'inductance.

3. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un premier sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R1 et R2 du réseau.

4. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que, la variation de courant de la source de courant en fonction de la température s'effectuant dans un second sens, l'autre borne de la source de courant est connectée au point de connexion entre les résistances R3, R4 et la résistance de décalage (Roffset) du circuit de compensation.

5. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la source de courant du circuit de compensation en température (20, 24) peut être réalisée de différentes façons, par exemple à partir des tensions aux bornes de réseaux de composants électriques ou électroniques parmi lesquels nous pouvons citer :

- les résistances variables en fonction de la température (résistances platines, résistance silicium, par exemple résistance de dénomination commerciale KTY du fabricant « INFINEON » ...);
- les diodes dont la tension de seuil varie avec la température (-2mV/°C);
- ou tout autre circuit électronique fournissant une tension ou un courant dépendant de la température (capteur de température intégré comme le AD590 du fabricant « Analog Device »...).

6. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce qu'il comporte :

- le réseau (10) en parallèle avec l'inductance (12) connecté aux bornes A et B ayant la résistance R2 en série avec la résistance R1 en parallèle avec la capacité C1,
- un circuit de décalage de tension (22) comportant le générateur E connecté en parallèle avec une résistance de décalage R15 (ou résistance d'offset) en série avec deux résistances R3 et R4 en parallèle, le pôle positif

du générateur E étant connecté au point commun des deux résistances R3 et R4 du côté de ces résistances et au point commun de la résistance R1 et la capacité C1 reliés à la borne B de l'inductance 12, le pôle négatif du générateur E étant relié à la résistance de décalage R15.

- un circuit de compensation en température (24) comportant une résistance R14 reliée par une de ces deux bornes au point commun entre les deux résistances R1 et R2 du réseau et par l'autre borne à une sortie ps d'un pont diviseur comportant une résistance R13 en série avec une thermistance RKTY, le pont diviseur étant connecté, du côté de la thermistance RKTY au pôle positif du générateur E et du côté de la résistance R13 au pôle négatif du générateur E.

7. Dispositif de mesure de courant selon la revendication 6, caractérisé en ce que la thermistance RKTY est à base de silicium dont la résistance varie de façon sensiblement linéaire en fonction de la température.

8. Dispositif de mesure de courant selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte une capacité C1' en parallèle sur les résistances R3 et R4.

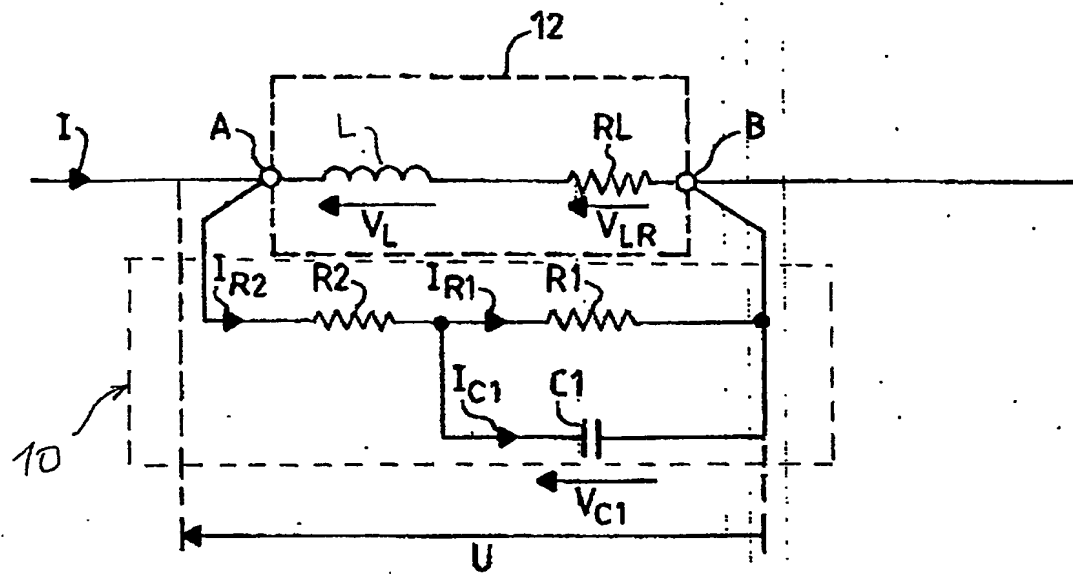


FIG. 1

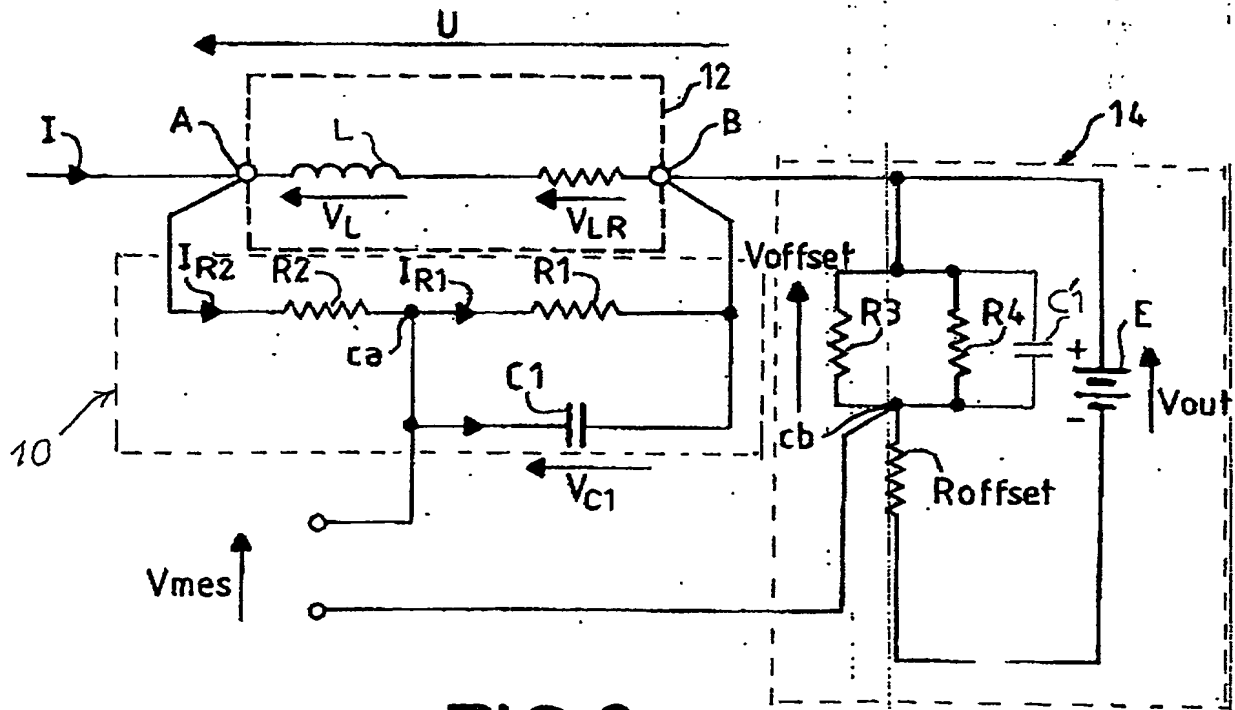


FIG. 2

1/4

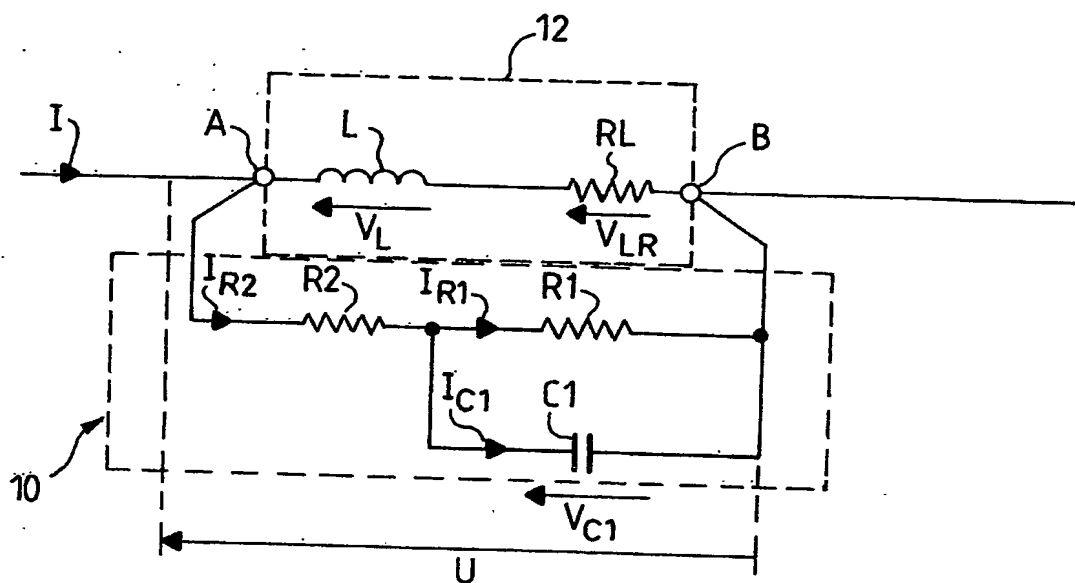


FIG. 1

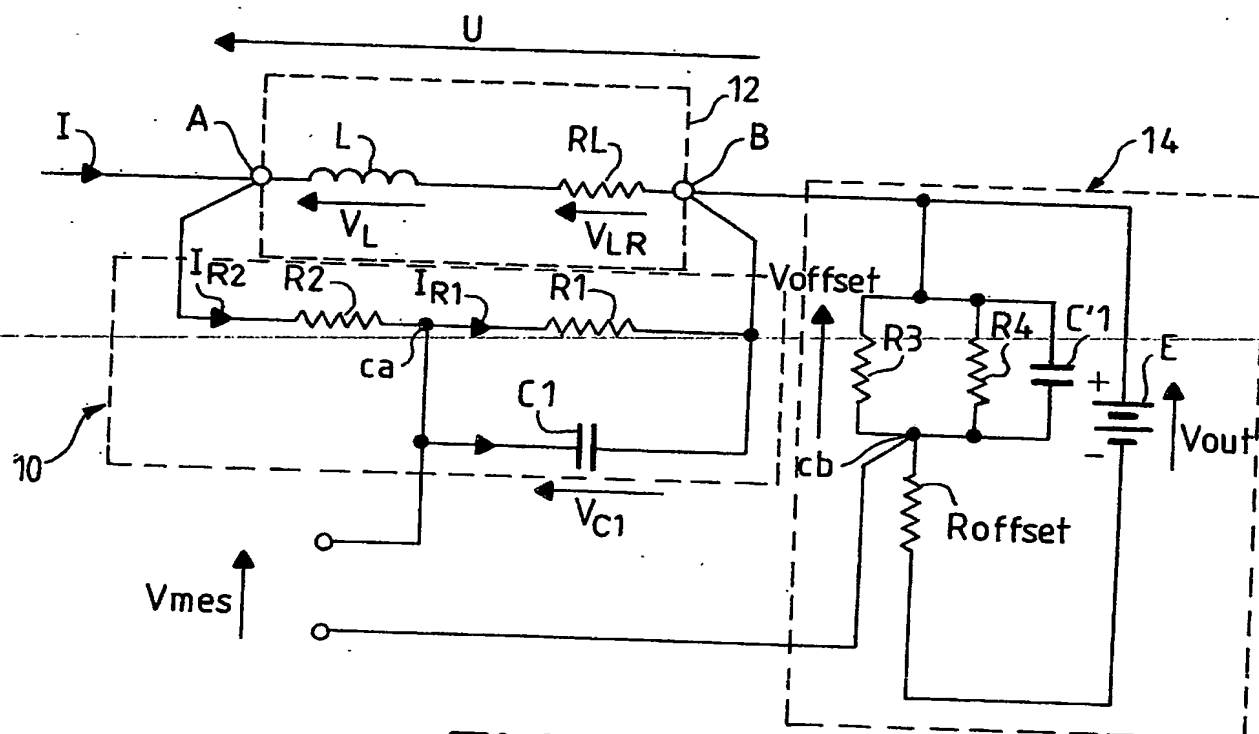


FIG. 2

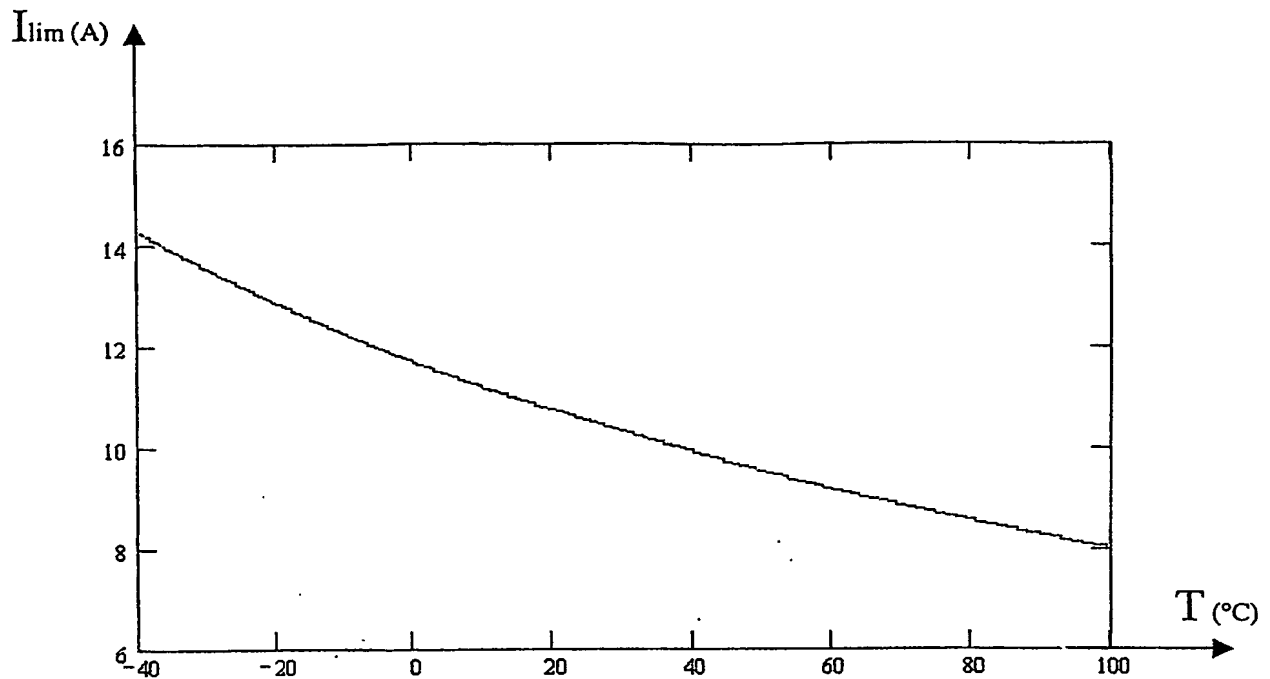


Fig 3

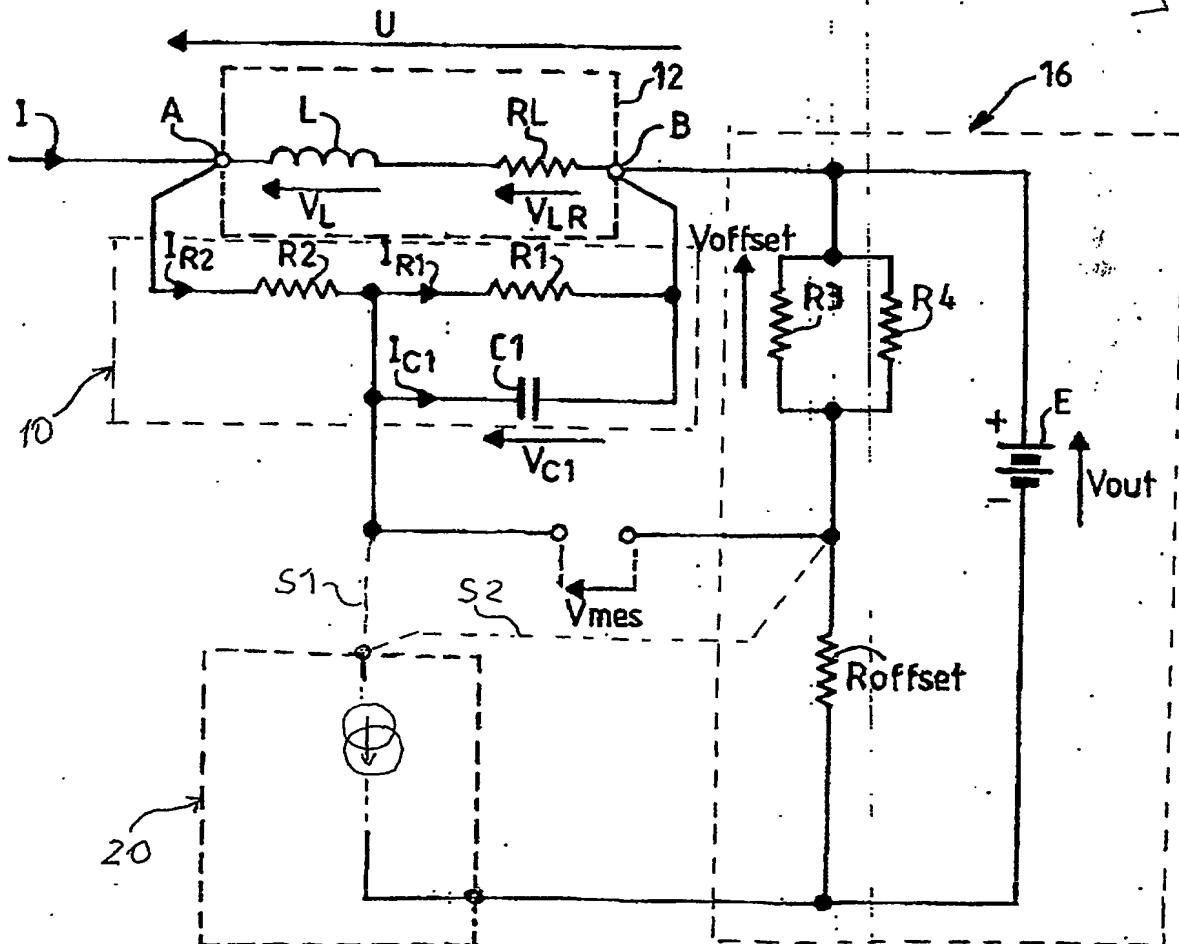


FIG. 4a

2/4

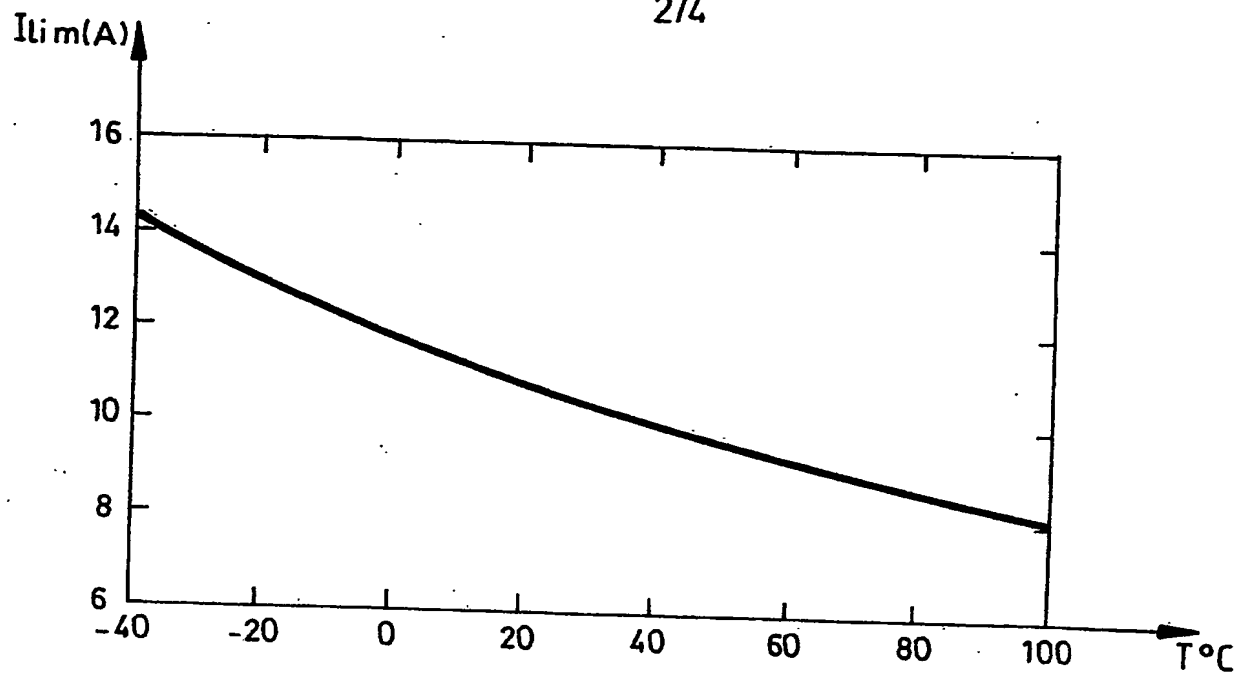


FIG.3

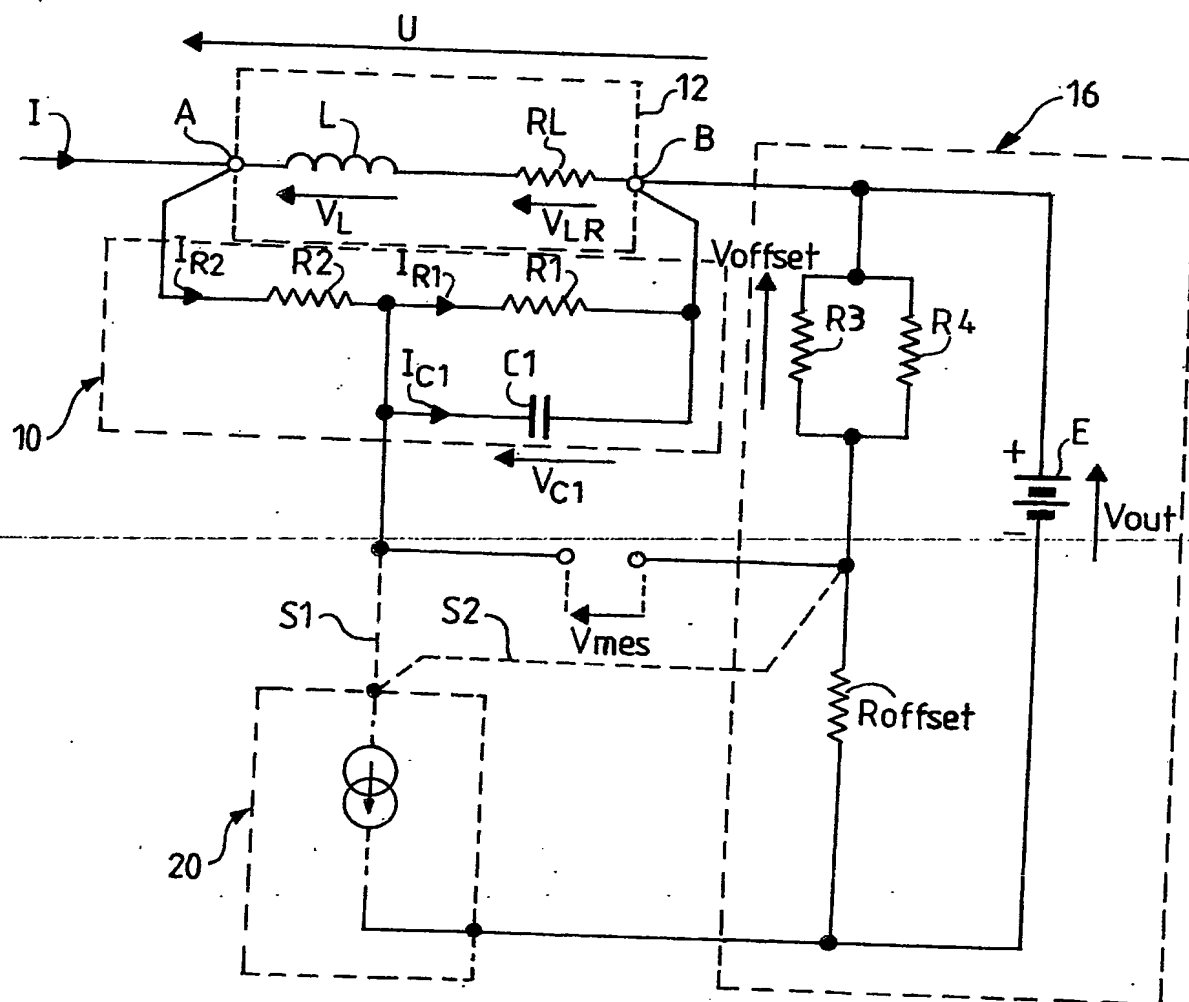


FIG.4a

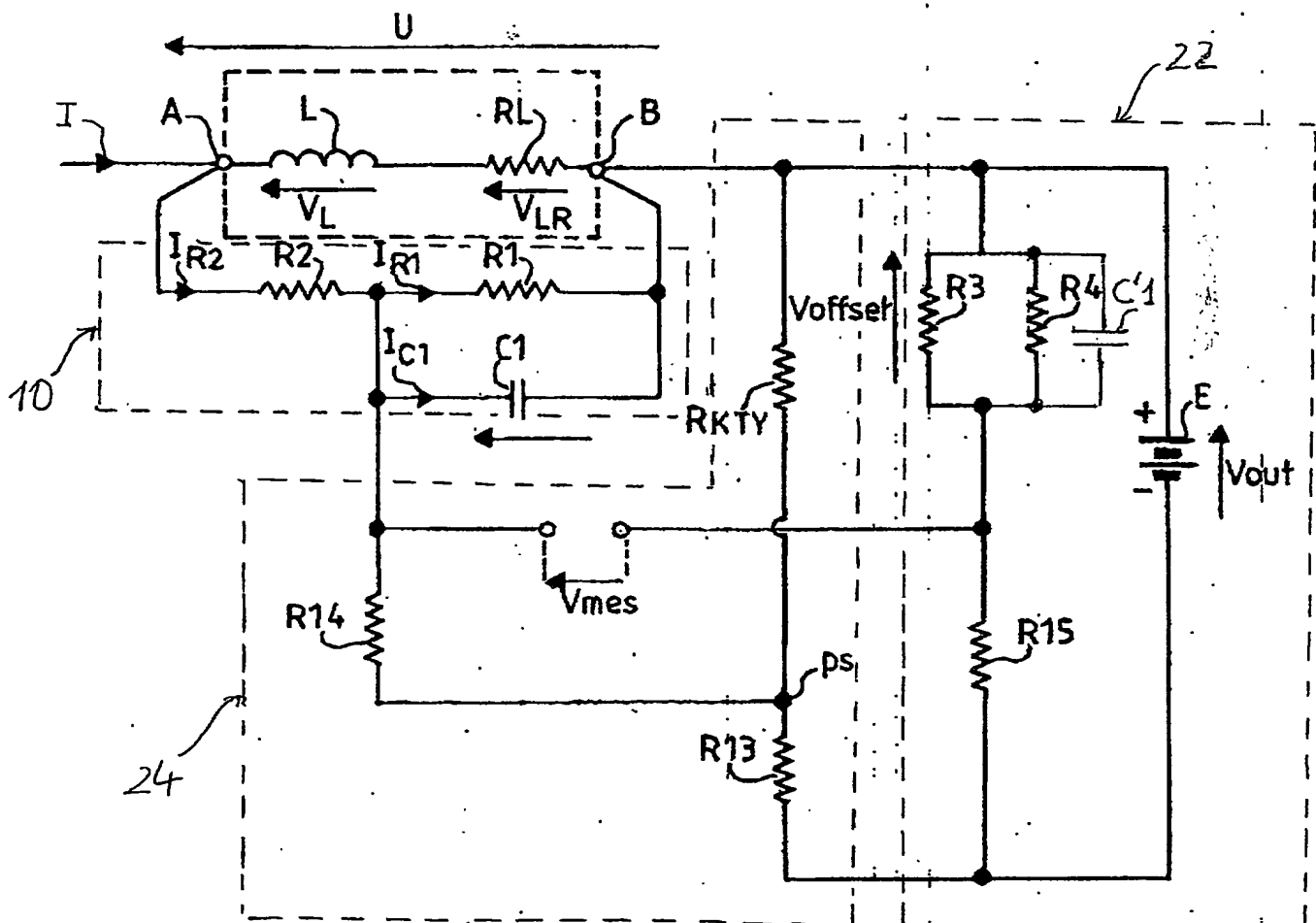
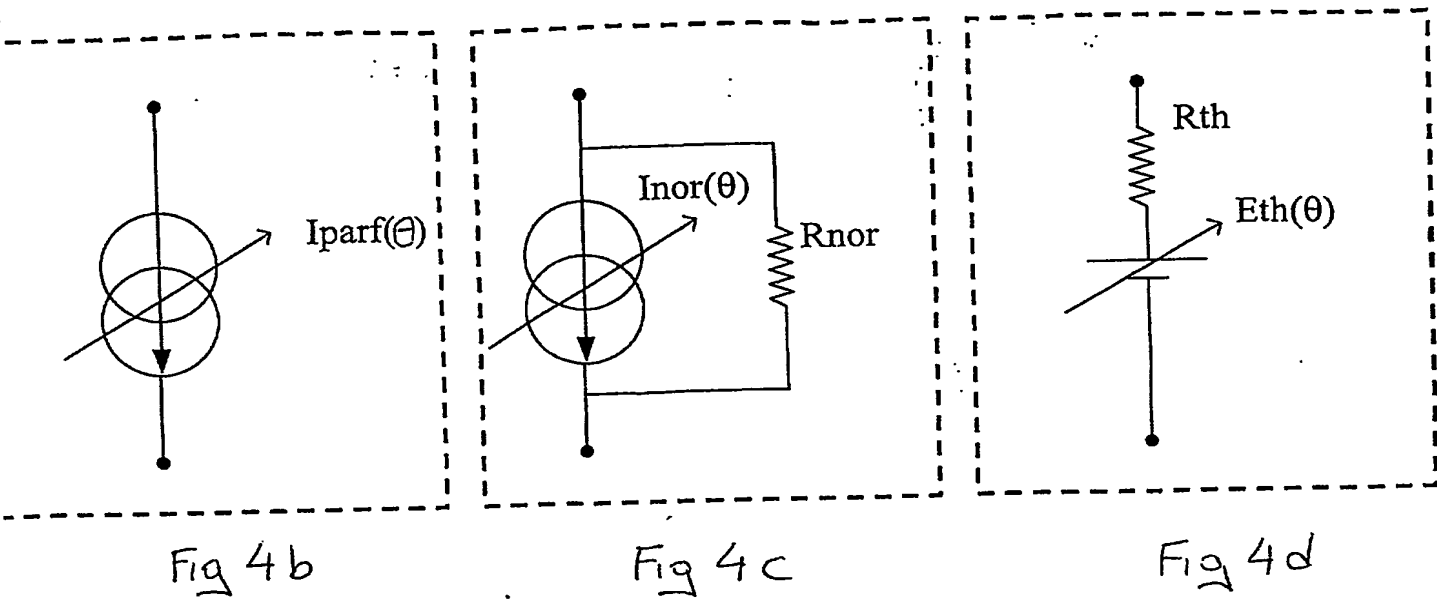


FIG. 5

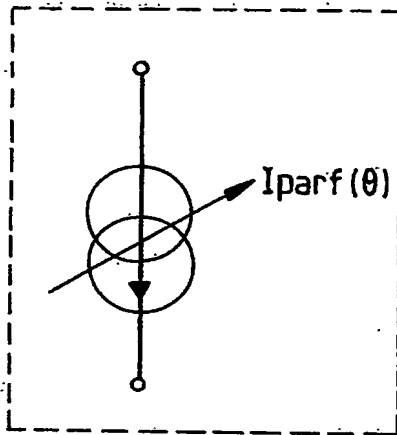


FIG. 4b

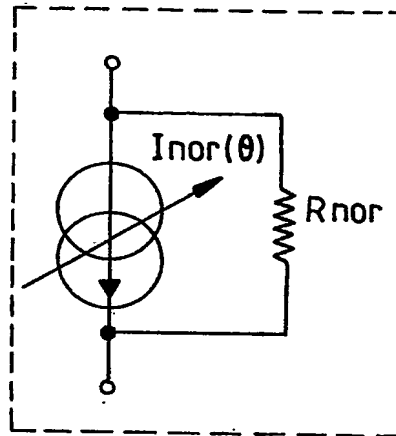


FIG. 4c

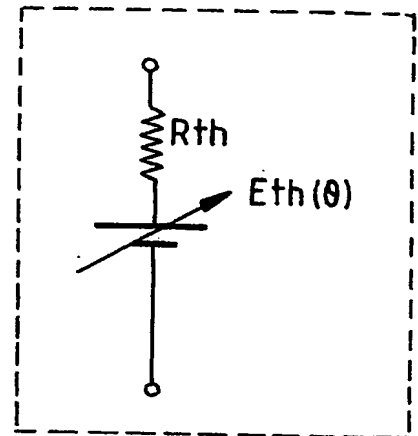


FIG. 4d

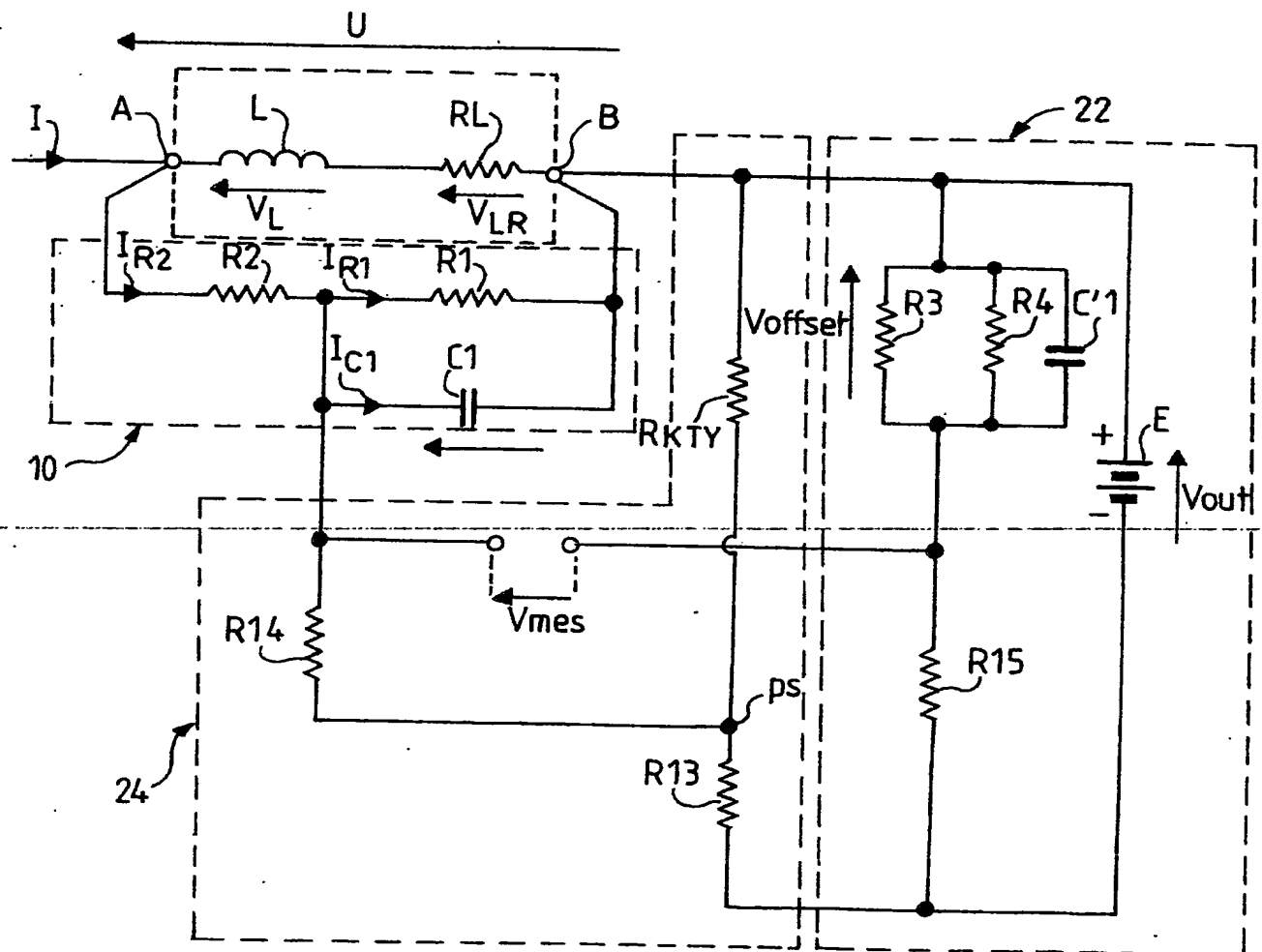


FIG. 5

4/4

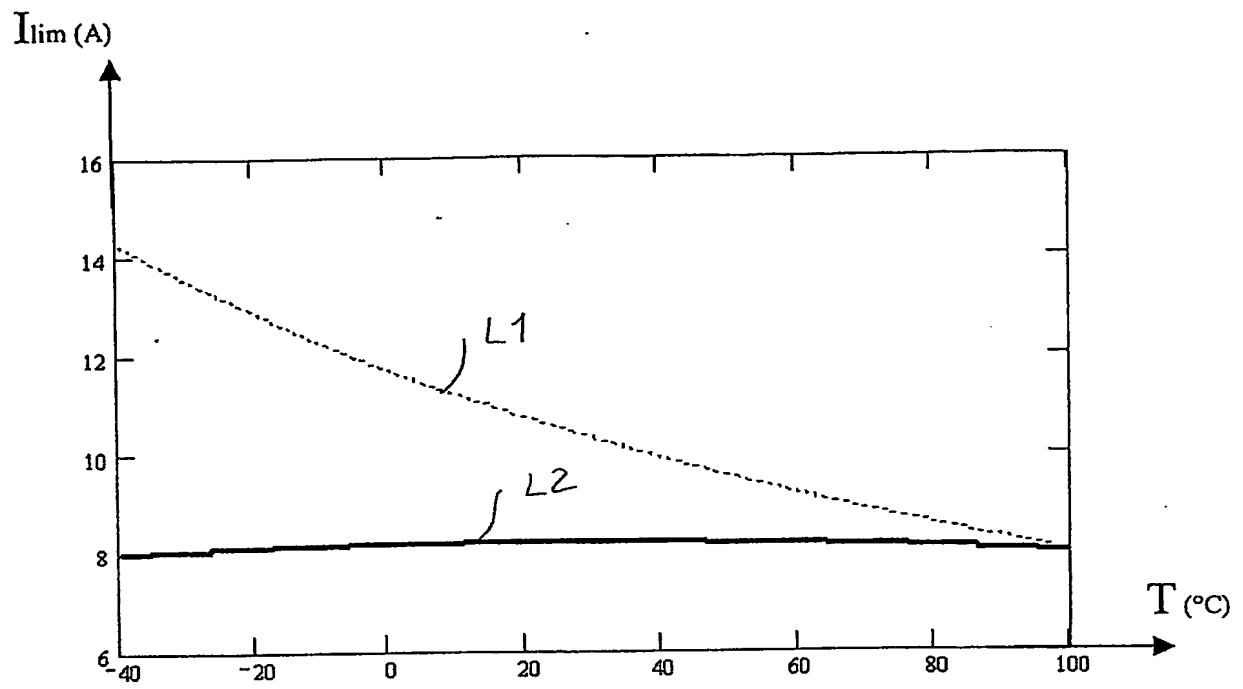


Fig. 6

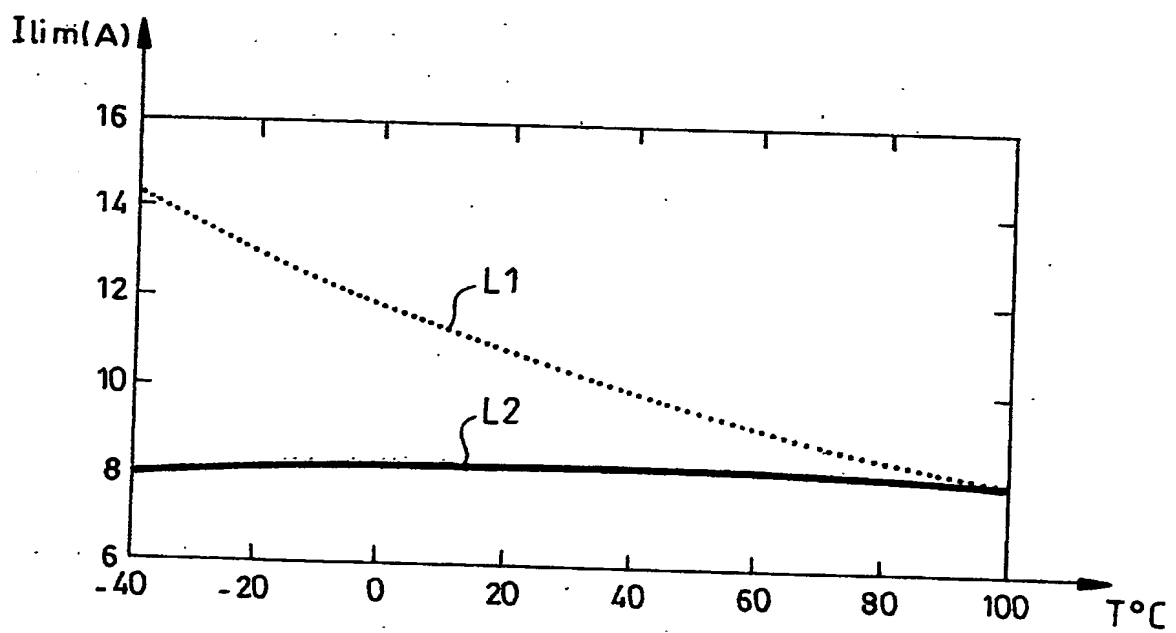


FIG.6



26 bis, rue de Saint Pétersbourg - 75800 Paris Cedex 08

Pour vous informer : INPI DIRECT

► N° Indigo 0 825 83 85 87
0,15 € TTC/min

Télécopie : 33 (0)1 53 04 52 65

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03


DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1.. / 1..



(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 210103

Vos références pour ce dossier (facultatif)		63207
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		0312294
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
DISPOSITIF DE MESURE NON DISSIPATIF DU COURANT DANS UNE INDUCTANCE		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
THALES		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		BLANC
Prénoms		Flavien
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, Avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	91411171 ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		TAURAND
Prénoms		Christophe
Adresse	Rue	THALES INTELLECTUAL PROPERTY 31-33, Avenue Aristide Briand
	Code postal et ville	91411171 ARCUEIL CEDEX
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	111111
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
21 octobre 2003 Mariano DOMINGUEZ 		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record.**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.